

# (12) International Application Status Report

**Received at International Bureau:** 11 September 2019 (11.09.2019)

**Information valid as of:** 24 September 2019 (24.09.2019)

**Report generated on:** 22 January 2021 (22.01.2021)

**(10) Publication number:**

WO2020/194786

**(43) Publication date:**

01 October 2020 (01.10.2020)

**(26) Publication language:**

Japanese (JA)

**(21) Application Number:**

PCT/JP2019/034371

**(22) Filing Date:**

02 September 2019 (02.09.2019)

**(25) Filing language:**

Japanese (JA)

**(31) Priority number(s):**

2019-060076 (JP)

**(31) Priority date(s):**

27 March 2019 (27.03.2019)

**(31) Priority status:**

Priority document received (in compliance with PCT Rule 17.1)

**(51) International Patent Classification:**

**G01R 33/12** (2006.01); **G01R 33/02** (2006.01); **G01R 35/00** (2006.01)

**(71) Applicant(s):**

NATIONAL INSTITUTE OF ADVANCED INDUSTRIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY [JP/JP]; 3-1, Kasumigaseki 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008921 (JP) *(for all designated states)*

**(72) Inventor(s):**

TAMARU Shingo; c/o National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Tsukuba Central 1, 1-1, Umezono 1-chome, Tsukuba-shi, Ibaraki 3058560 (JP)

**(54) Title (EN):** PERMEABILITY MEASUREMENT JIG, PERMEABILITY MEASUREMENT DEVICE, AND PERMEABILITY MEASUREMENT METHOD

**(54) Title (FR):** GABARIT DE MESURE DE PERMÉABILITÉ, DISPOSITIF DE MESURE DE PERMÉABILITÉ, ET PROCÉDÉ DE MESURE DE PERMÉABILITÉ

**(54) Title (JA):** 透磁率測定用治具、透磁率測定装置および透磁率測定方法

**(57) Abstract:**

**(EN):** The present disclosure provides a permeability measurement jig 10 including: a first waveguide 20 in which a signal line 22 at one end thereof has an excitation section 22b that generates a magnetic field in response to an excitation signal; and a second waveguide 30 in which a signal line 32 at one end thereof has a detection section 32b where the magnetic field generated by the excitation section acts on a measurement sample 46 to induce a detection signal, and the detection section is disposed above and so as to face the excitation section at a prescribed distance. Also disclosed are a permeability measurement device including the permeability measurement jig 10, as well as a method for measuring permeability.

**(FR):** La présente invention porte sur un gabarit de mesure de perméabilité 10 comprenant : un premier guide d'ondes 20 dans lequel une ligne de signal 22 à une extrémité de celui-ci a une section d'excitation 22b qui génère un champ magnétique en réponse à un signal d'excitation ; et un second guide d'ondes 30 dans lequel une ligne de signal 32 à une extrémité de celui-ci a une section de détection 32b où le champ magnétique généré par la section d'excitation agit sur un échantillon de mesure 46 pour induire un signal de détection, et la section de détection est disposée au-dessus et de manière à faire face à la section d'excitation à une distance prescrite. L'invention concerne également un dispositif de mesure de la perméabilité comprenant le gabarit de mesure de la perméabilité 10, ainsi qu'une méthode pour mesurer la perméabilité.

**(JA):** 本開示では、第 1 の導波路 20 であって、その信号線路 22 が一端側に励起信号により磁界を発生する励磁部 22b を有する、上記第 1 の導波路と、第 2 の導波路 30 であって、その信号線路 32 が一端側に上記励磁部で発生した磁界が測定試料 46 に作用して検知信号が誘起する検知部 32b を有し、その検知部が上記励磁部上に所定の距離をもって対向して配置してなる、上記第 2 の導波路と、を含む、透磁率測定用治具 10 が提供される。透磁率測定用治具 10 を有する透磁率測定装置および透磁率の測定方法も開示する。

**International search report:**

Received at International Bureau: 07 October 2019 (07.10.2019) [JP]

## **International Report on Patentability (IPRP) Chapter II of the PCT:**

Not available

### **(81) Designated States:**

AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW

European Patent Office (EPO) : AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR

African Intellectual Property Organization (OAPI) : BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG

African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) : BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW

Eurasian Patent Organization (EAPO) : AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM